

Primärstrahlfilterdicke	0,12 mm
Detektorblendenmaterial	Al
Detektorblendenöffnung	3 mm
Detektorzeitkonstante	2 $\mu$ s

Durch diese Anregungsbedingungen wurde eine konstante Anregung der Fluoreszenzlinien über den gesamten Spektralbereich von 3 bis 40 keV erzielt.

Nach der Optimierung der EDRFA-Anregungsbedingungen wurde der Einfluß der Probenposition auf die Spektrenqualität und die Optimierungsmöglichkeiten der Spektrenauswertung und –bearbeitung untersucht. Für den weiteren Betrieb bezüglich der Probenposition und Spektrenbearbeitung ergaben sich folgende Erkenntnisse (vgl. Kapitel 4):

- Die Verpackung wird direkt an die Probenkammerwand (y-Achsen-Koordinate: 0 und 10 mm rechts vom Detektor (x-Achsen-Koordinate: 10) positioniert, um sowohl für Glas- als auch für PE-Verpackung ein optimales S/N-Verhältnis zu erreichen (s. Abb. 4.7).
- Die Spektren werden mit einer Kanalanzahl von 1024 Kanälen aufgenommen. Die Kanal-Energie-Kalibration erfolgt über ein Polynom 3. Grades.
- Die Spektren werden weder geglättet noch zur weiteren Bearbeitung differenziert.

## 6.4 Interpretation und Zuordnung der EDRFA-Spektren

In Abschnitt 5.1 wurden die Zuordnungsgruppen für die EDRFA als abfallspezifische Zuordnung nach den gesetzlichen Grundlagen definiert. Sämtliche anorganische Substanzen lassen sich in eine der drei definierten Zuordnungsgruppen einordnen (s. Abschnitt 5.1.1).

Eine abfallspezifische Zuordnung von Substanzen durch die ungeöffnete PE-Verpackung ist möglich.

Eine auf Peakparametern basierende Elementidentifizierung in der EDRFA setzt eine genaue Kenntnis über die Verpackung und ihrer Meßposition voraus. Niederenergetische Röntgenfluoreszenzsignale werden durch variierende Verpackungswanddicken besonders stark beeinflusst. Das kann zu Falschzuordnungen führen. Um gleiche Analysenbedingungen zu erreichen, muß sichergestellt sein, daß immer dieselbe Verpackungsseite vor dem Detektor positioniert ist. In dieser Arbeit wurden die von der Verpackungswanddicke unabhängigen Peakparameter ermittelt. Neben der Peakposition, der FWHM, dem S/N-Verhältnis ist das Peakflächenverhältnis

$\text{Fläche}_{K\alpha}/(\text{Fläche}_{K\alpha} + \text{Fläche}_{K\beta})$  unabhängig von der Verpackungswanddicke (vgl. Abschnitt 5.1.2).

## 6.5 Unterteilung der Zuordnungsgruppen mit der Matrixkorrektur und der Methode der mittleren Ordnungszahl

Die Matrixkorrektur mit Hilfe des Compton-Streupeaks wird in der herkömmlichen EDRFA-Auswertung zur Standardisierung angewendet. Eine allgemeingültige Anwendung der Matrixkorrektur auf die durch die Verpackung gemessenen Elementlinien der Ein-Element-Gruppen ist aufgrund der großen Meßwertstreuung und des nicht vorhandenen linearen Zusammenhanges zwischen dem Elementmassengewichtsanteil und der korrigierten Peakfläche bei einzelnen Ordnungszahlen (z.B. Eisen) durch die Verpackung nicht möglich (vgl. Abschnitt 5.2.3).

Die Auftragung der  $\overline{OZ}$  gegen das Rayleigh-/Compton-Verhältnis ergibt nach der Literatur<sup>[141]</sup> einen linearen Verlauf. Dieser Verlauf wird in dieser Arbeit für die Elemente im unteren  $\overline{OZ}$ -Bereich von 6 bis 14 bestätigt, zeigt jedoch sehr große Meßwertstreuungen. Im  $\overline{OZ}$ -Bereich von 14 bis 29 und von 32 bis 82 ist eine Zuordnung des Rayleigh-/Compton-Streupeakverhältnisses zu ihrer Substanz über die  $\overline{OZ}$  aufgrund der geringen Steigung im Vergleich zur großen Meßwertstreuung nicht mehr realisierbar (vgl. Abschnitt 5.2.3). Hier spielt der Einfluß der Verpackung auf den Compton- und Rayleigh-Streubereich eine in späteren Arbeiten noch zu untersuchende Rolle.

## 6.6 Anwendung der PCA auf die EDRFA-Spektren

Durch Projektion der EDRFA-Spektren von Substanzen in einem durch die HK beschriebenen neuen Datenraum wird die eigentliche analytische Information vom Fehler (z.B. Rauschen) separiert. Mit Hilfe dieser Darstellungsform lassen sich aufgrund der für die PCA erkennbaren spektralen Unterschiede Gruppen und Ausreißer erkennen. Dies ist mit der herkömmlichen EDRFA-Auswertung (Bestimmung und Bearbeitung der Fluoreszenzlinien und ihre anschließende Zuordnung zu einer Elementkonzentration) nicht erkennbar und darstellbar.

Einzelne Verbindungen aus den Ein-Element-Gruppen Chrom, Eisen, Kupfer, Barium und Blei wurden mit der PCA untersucht. Sie wurden in dem durch die HK aufgespannten neuen Datenraum voneinander unterschieden. Die optimale Auftrennung der einzelnen Gruppen bei

ausgewählten Substanzen der Kein-Element-Gruppe wurde durch die alleinige Verwendung des Compton- und Rayleigh-Streubereichs in der PCA erreicht. Die Auftragung der Variablen (= Spektralbereich) gegen die Loadings der einzelnen HK bestätigte diesen Sachverhalt.

Aus den Loading-Plots für die Kombination aus Fluoreszenzlinien, Compton- und Rayleigh-Streubereich der Chrom-, Eisen-, Kupfer- und Bleiverbindungen ist zu erkennen, daß mit steigender  $\overline{OZ}$  der Einfluß der Fluoreszenzlinien auf die Loadings der zweiten HK abnimmt.

Die Bariumverbindungen werden durch die Kombination der K-Fluoreszenzlinien, Compton- und Rayleigh-Streubereiche nicht aufgetrennt. Die Auftrennung der Bariumverbindungen im neuen Koordinatenraum wird durch die Fluoreszenzlinien des Strontiums, das als Verunreinigungen in den Bariumverbindungen vorliegt, hervorgerufen.

In einem ersten Versuch wurde der Einfluß verschiedener physikalisch-chemischer Substanz-eigenschaften (molaren Masse, physikalischen Dichte, mittlere Ordnungszahl und Massenschwächungskoeffizient) auf die ersten zwei HK für die Ein-Element-Gruppen und der Kein-Element-Gruppe untersucht. Bei allen Meßreihen war ein Zusammenhang sowohl zwischen der mittleren Ordnungszahl als auch zwischen dem Massenschwächungskoeffizient und der ersten HK zu erkennen. Der lineare Fit der beiden Funktionen  $HK\ 1 = f(\overline{OZ})$  und  $HK\ 1 = f(\mu)$  für die Verbindungen der Chromgruppe und der logarithmische Fit der beiden Funktionen  $HK\ 1 = f(\overline{OZ})$  und  $HK\ 1 = f(\mu)$  für die Substanzen der Kein-Element-Gruppe zeigten bei dem Zusammenhang  $HK\ 1 = f(\mu)$  ein höheres Bestimmtheitsmaß. Der Einfluß auf HK 1 wird somit besser durch den Massenschwächungskoeffizienten beschrieben.

Hier ist letztendlich noch weiterer Klärungsbedarf notwendig, denn die  $\overline{OZ}$  und der Massenschwächungskoeffizient decken nicht das komplette, durch die PCA beschriebene Modell ab. Im Rahmen weiterer Untersuchungen ist der Einfluß anderer physikalisch-chemischer Eigenschaften, wie z.B. der Partikelgröße, der Schüttdichte und dem Kristallwassergehalt auf die HK zu untersuchen. Diese Ergebnisse sind zu quantifizieren, d.h. Zusammenhänge in Form von Funktionen und Abhängigkeiten mathematisch zu beschreiben. Der Einfluß der unterschiedlichen Verpackungsarten und -wanddicken sind ebenfalls zu berücksichtigen und in Form von ermittelten Korrekturfaktoren in das Modell mit einzubeziehen.

Die Mehr-Element-Gruppen wurden aufgrund der hohen analytischen Information aus den Fluoreszenzsignalen und der geringen Unsicherheit der analytischen Aussage mit der herkömmlichen EDRFA-Auswertung (s. Abschnitt 5.2.1) und nicht mit der PCA untersucht. Bei einigen EDRFA-Spektren von Substanzen der Mehr-Element-Gruppe ist die eindeutige Inter-

pretation von Substanzen nicht möglich (z.B.  $\text{HgI}_2$  und  $\text{Hg}(\text{IO}_3)_2$ ). In diesem Fall bleibt die praktische Relevanz dieser Unterscheidung, d.h. Wiedereinsatz dieser beiden Substanzen in der Produktion, abzuwarten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß

im Vergleich zur herkömmlichen EDRFA-Auswertung die spektralen Unterschiede der durch die Verpackung aufgenommenen EDRFA-Spektren von den ausgewählten Substanzen aus den Ein-Element-Gruppen und der Kein-Element-Gruppe für die PCA groß genug ist, um die Substanzspektren in dem durch die HK aufgespannten neuen Datenraum aufzutrennen.

## 6.7 Anwendung der RDA auf die EDRFA-Spektren

Aus den verschiedenen Klassifizierungsalgorithmen wurde die RDA für diese Aufgabenstellung ausgewählt. Aufgrund der Datenmatrixform (spärlich besetzte Matrices) war eine Klassifizierung mit anderen Klassifizierungsmethoden (QDA, LDA) mathematisch nicht lösbar.

Durch die Verpackung aufgenommene EDRFA-Spektren sind mit Hilfe der dafür ermittelten RDA-Modelle voneinander unterscheidbar, wenn die Spektren für die RDA erkennbare spektrale Unterschiede aufweisen. Für die ausgewählten Substanzspektren der Ein-Element-Gruppen Chrom und Eisen ist eine Zuordnung der Substanzen zu einer zuvor definierten Klasse mit dem Spektralbereich (Fluoreszenzlinien-, Compton- und Rayleigh-Streubereich) und mit den signifikanten HK aus der PCA als Variablen möglich. Für die Eisen-Gruppe ist die Klassifizierung mit dem Spektralbereich nach dem Falschklassifizierungsrisiko sogar besser (berechnet durch eine interne Kreuzvalidierung des Eisen-Datensatzes).

Die Klassifizierung der ausgewählten Substanzspektren der Kein-Element-Gruppe ist mit deren RDA-Modellen möglich. Trotz des geringeren Falschklassifizierungsrisikos durch Verwendung der signifikanten HK als Variablen ist die Anzahl der eindeutig klassifizierten Substanzen für beide Variablenarten (Spektralbereich und HK) gleich (ermittelt durch einen Testdatensatz).

Die Validierung des RDA-Modells für den Kein-Element-Gruppe-Lerndatensatz mit einem Testdatensatz, zusammengesetzt aus drei voneinander unabhängig aufgenommenen Meßreihen zeigt, daß die Klassifizierung mit der RDA reproduzierbar ist. Für die Validierung des RDA-Modells unter Verwendung des Compton- und Rayleigh-Streubereichs als Variablen wurden von den 20 Substanzen 17 eindeutig zugeordnet. Hingegen werden mit den ersten

signifikanten HK als Variablen 15 von 20 Substanzen eindeutig zugeordnet. Das wird durch das geringere Falschklassifizierungsrisiko für den Spektralbereich als Variablen bestätigt.

Die Klassifizierung der Substanzspektren mit Hilfe des RDA-Modells steht noch am Anfang der Untersuchungen. Im Rahmen weiterer Arbeiten ist diese Klassifizierungsmethode ebenfalls mathematisch zu beschreiben und zu optimieren, z.B. Definitionen von anderen Gruppen, die auf physikalischen Parameter basieren bzw. in denen die physikalischen Parameter und Korrekturfaktoren für die verschiedenen Verpackungswanddicken berücksichtigt werden. Weiterhin ist die Methode mit einer größeren Anzahl an Daten auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Zusammenfassend gilt, daß

mit RDA-Modellen die durch die Verpackung aufgenommenen EDRFA-Spektren von Substanzen aus den Ein-Element-Gruppen und der Kein-Element-Gruppe zu klassifizieren und zu unterscheiden sind.

Anhand der bisher erhaltenen Ergebnisse aus den PCA-Berechnungen, der Klassifizierung mit RDA-Modellen und aus der herkömmlichen EDRFA-Auswertung kann eine erste Abschätzung für die eindeutige Zuordnung von festen anorganischen Substanzen nach abfallspezifischen Kriterien (in %) gegeben werden. Grundlage sind die anorganischen Verbindungen (in PE-Verpackungen) des Merck-Chemikalienkatalogs<sup>[17]</sup>.

Element	Anzahl untersuchter Verbindungen	Anzahl zugeordneter Verbindungen	Anteil an richtigen Zuordnungen [%]	Anzahl der Verbindungen im Chemikalienkatalog <sup>[17]</sup> (in PE-Verpackungen)
NH <sub>4</sub>	3	3	100	20
Li	3	3	100	12
Be	1	1	100	3
B	1	1	100	4
Na	5	5	100	42
Mg	2	2	100	14
K	5	4	80	41
Ca	3	2	67	13
Cr	5	5	100	7
Fe	7	5	71	9
Cu	5	4	80	11
Ba	4	3 <sup>1)</sup>	75	10
Pb	4	4	100	14

<sup>1)</sup> Auftrennung der Bariumverbindungen über die Strontium-Fluoreszenzlinien

Zuordnungsgruppen	Zuordnung nach abfallspezifischen Kriterien möglich (bezogen auf feste anorganische Substanzen)
Mehr-Element-Gruppe (Zuordnung mit herkömmlicher EDRFA-Auswertung)	ca. 3%
Ein-Element-Gruppe (Zuordnung mit herkömmlicher EDRFA-Auswertung)	ca. 20%
Ein-Element-Gruppe (Zuordnung mit RDA-Modell)	ca. 22%
Kein-Element-Gruppe (Zuordnung mit herkömmlicher EDRFA-Auswertung)	0%
Kein-Element-Gruppe (Zuordnung mit RDA-Modell)	ca. 35%
Summe:	ca. 80%

Aus den ersten Abschätzungen können nach bisherigem Kenntnisstand ca. 80% der anorganischen Substanzen eindeutig im Rahmen der abfallspezifischen Zuordnung mit den jeweiligen PCA-Berechnungen unterschieden und mit den RDA-Modellen klassifiziert werden. Die prozentualen Angaben wurden aus den Ergebnissen der multivariaten Berechnungen abgeschätzt. Die Wahrscheinlichkeit der Falschklassifizierung wird mit einer größeren Anzahl an Substanzen zunehmen.

Mit steigender Ordnungszahl der Probe nehmen die Eindringtiefe der Röntgenstrahlen sowie die Compton- und Rayleigh-Streuintensitäten ab. Dadurch verringert sich die substanzspezifische Information bei der Wechselwirkung zwischen Röntgenstrahlung und Probe. In der PCA ist dieser Zusammenhang zwischen Eindringtiefe, Compton- und Rayleigh-Streuintensität und der  $\overline{OZ}$  zu erkennen. Je größer die Ausdehnung der HK für eine Gruppierung von Substanzen der gleichen  $\overline{OZ}$  im Score-Plot, um so geringer ist die Eindringtiefe sowie die Compton- und Rayleigh-Streuintensität der Röntgenstrahlung in der Probe. Substanzen der Ein-Element-Gruppe mit hohem  $\overline{OZ}$  werden dadurch im Score-Plot schlechter aufgetrennt.

## 6.8 Einfluß der Meßzeit

Die Meßzeit soll nach Vorgaben der Fa. Merck kleiner 30 s sein. Versuche zur Auswahl der geeigneten Meßzeit wurden anhand der Elementlinienidentifizierung (vgl. Abschnitt 4.5) sowie der Auflösung und Lage einzelner Substanzen im durch die HK erhaltenen neuen Datenraum (vgl. Abschnitt 5.4) durchgeführt. Beide Versuchsreihen zeigen, daß Meßzeiten kleiner 20 s keine statistisch abgesicherten Resultate erbringen. Die Meßunsicherheit ist dabei zu groß.

Somit wurde die Forderung der Fa. Merck erfüllt und eine Meßzeit kleiner 30 s, nämlich eine Verringerung auf 20 s, für diese Aufgabenstellung realisiert. Diese Verringerung der Meßzeit erlaubt einen höheren Durchsatz an zu analysierenden Substanzen, was eine effektivere Nutzung und Auslastung des Logistikkonzepts bei der Rücknahme von Laborchemikalien bewirkt.

## 7 Literaturverzeichnis

- [1] "Wohin mit den nicht mehr einsetzbaren Chemikalien" *Standort Chemie* **1994** 12/1, 10
- [2] "Zurück in die Produktion" *Chemieproduktion* **Dez. 1995**, 30-32
- [3] Müller, D., "Sonderabfallfreie Chemie – Eine Vision" *GIT Laborfachzeitschrift* **1996** 40, 1158-1161
- [4] Müller, D., "Kreislaufwirtschaft im Chemiebereich" *CAV* **1997** 3, 62-64
- [5] Itzel, H., "Designlenkung und Projektkoordination" *QM-Handbuch ZRW - Verfahrensanleitung* - **23.07.1997**, Fa. Merck
- [6] "Rückführung von Laborchemikalien via Internet" *Europa Chemie*, **1997** 10, 92-93
- [7] *Retrologistik® Dokumentation* **1996**
- [8] *Kreislaufwirtschafts- und Abfallvermeidungsgesetz (Krw-/AbfG)* **1994** (BGBl. I, 1354)
- [9] *Verordnung Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft* **1993** (ABl. L 30, 1)
- [10] *Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs (EAK-Verordnung)* **1996** (BGBl. I 1428)
- [11] *Verordnung zur Bestimmung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen (BestbÜAbfV)* **1996** (BGBl. I 1366)
- [12] *Verordnung zur Bestimmung von überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung (BestbÜAbfV)* **1996** (BGBl. I 1377)
- [13] *Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall)* **1991** (GMBl. S. 139, ber. 496)
- [14] *Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV)* **1993** (BGBl. I 1782)
- [15] Koch, K.H., *Industrielle Prozeßanalytik* **1997** Springer Verlag, Berlin
- [16] Nichols, G.D., *On-line Process Analyzers* **1988** John Wiley & Sons, New-York
- [17] *Reagenzien, Chemikalien Diagnostika* **1996** Merck-Katalog
- [18] Molt, K., "Grundlagen und Anwendungen der modernen NIR-Spektroskopie, Teil 1: Spektroskopische und chemometrische Grundlagen" *GIT Fachz. Lab.* **1992** 2, 107-113
- [19] Liekmeier, W., *Angewandte UV-Spektroskopie* **1984** 12, 4-20 (Schulungsunterlagen v. Perkin Elmer)
- [20] Falbe, J.; Regitz, M., *Römpp Chemie Lexikon* **1989** 9. Auflage Bd. 3, Thieme Verlag Stuttgart
- [21] Cameron, D.G.; Casal, H.L., "Transforming a spectrometer into an analyzer" *Proc. Annu. ISA Anal. Div. Symp.* **1994** 27, 29-34
- [22] Doyle, W.M., "Near - IR and mid-IR process analysis - a critical comparison" *Proc. Control Qual.* **1992** 2, 11 ff.



- [23] Molt, K., "Grundlagen und Anwendungen der modernen NIR-Spektroskopie, Teil 2: Anwendungen" *GIT Fachz. Lab.*, **1992** 4, 353-362
- [24] McDermott, L.P., "Approaches to applying near infrared spectroscopy on-line" *Adv. Instrum. Control* **1990** 45, 669-677
- [25] Workman, J.Jr., "A review of process near infrared spectroscopy: 1980-1994" *J. Near Infrared Spectrosc.* **1993** 14, 221-245
- [26] Xanthos, M.; Patel, S.H., "Recent developments in in-line spectroscopy/microscopy for monitoring extrusion processes" *Adv. Polym. Technol.* **1995** 142, 151-157
- [27] Patel, S.H.; Todd, D.B.; Xanthos, M., "Recent developments in online analytical techniques applicable to the polymer industry" *Annu. Tech. Conf. - Soc. Plast. Eng.* **1994** 52ndVol. 2, 2214-2219
- [28] Molt, K.; Ihlbrock, D., "Principles and applications of quality control by near infrared spectroscopy using the example of polymer additives" *Fresenius J. Anal. Chem.* **1994** 348, 523-529
- [29] Brown, G.K., "On-line polymeric measurements in real-time with NIR spectroscopy" *Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng.* **1992** 1681, 304-306
- [30] Hansen, M.G., "A review of on-line monitoring of polymeric processes by infrared spectrophotometry" *Annu. Tech. Conf. - Soc. Plast. Eng.* **1991** 49, 840-841
- [31] Mercer, P.G., "Measurement and control of barrier layers" *Tappi J.* **1990** 7311, 195-203
- [32] Espinosa, A.; Lambert, D.; Valleur, M., "Use NIR technology to optimize plant operations" *Hydrocarbon Process., Int. Ed.* **1995** 742, 86-89, 91-92
- [33] Lambert, D.; Descales, B.; Llinas, J.R.; Espinosa, A.; Osta, S.; Sanchez, M.; Martens, A., "On-line NIR monitoring and optimisation for refining and petrochemical processes" *Analisis* **1995** 23, M9-M13
- [34] Benson, I.B., "The characteristics and scope of continuous online near infrared measurement" *Spectrosc. Eur.* **1995** 76, 18, 20-24
- [35] Swientek, R.J., "Sensor technology in the food industry - composition analysis moves from the lab to the plant floor" *Adv. Instrum. Control* **1991** 461, 341-346
- [36] Blanco, M.; Coello, J.; Iturragia, H.; MasPOCH, S.; Betran, E., "Analysis of cotton-polyester yarns by near-infrared reflectance spectroscopy" *Analyst (Cambridge, UK)* **1994** 119, 1779-85
- [37] Hammond, R.P., "Practical and successful online near - infrared applications" *Process Control Qual.* **1997** 94, 117-121
- [38] Doyle, W.M., "Near - IR and mid-IR process analysis - a critical comparison" *Adv. Instrum. Control* **1995**, 50. 2, 209-25
- [39] Boulou, J.C., "Fiber optics and quality control in the near IR" *Spectra Anal.* **1994** 23176, 39-42

- [40] Siesler, H.W., "Vibrational spectroscopy of polymers. Analysis, physics, and process control" *Adv. Chem. Ser.* **1993** 236, 41-87
- [41] Grevesmuehl, B.; Kradjel, C.; Kellner, H., "Designing optimized industrial process analyzers for closed loop control" *J. Autom. Chem.* **1991** 134, 139-142
- [42] Otto, M., *Chemometrie -Statistik und Computereinsatz in der Analytik-* **1997** VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim
- [43] Falbe, J.; Regitz, M., *Römpp Chemie Lexikon* **1989** 9. Auflage Bd. 5, Thieme Verlag Stuttgart
- [44] Hesse, M.; Meier, H.; Zeeh, B., *Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie* **1991** Georg Thieme Verlag Stuttgart
- [45] Nguyen Q.D.; Jouan, M., "The Raman laser fiber optics RLFO method and its applications" *Sens. Actuators, B* **1993** B111-3, 147-160
- [46] Pelletier, M.J., "Raman spectroscopy outside the laboratory" *Proc. Annu. ISA Anal. Div. Symp.* **1998** 31, 63-72
- [47] Garrison, A.A., "Online analysis of chemical composition using an FT-Raman spectrometer in the near-IR" *Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng.* **1992** 1681, 291-293
- [48] Kerchel, S.W.; Roberts, M.J.; Garrison, A.A., "Recent advances in the development of a fiber-optic based instrument for on-line Raman analysis" *Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng.* **1990** 1336, 144-151
- [49] Keller, S.; Löchte, T.; Dippel, B.; Schrader, B. "Quality control of food with near-infrared-excited Raman spectroscopy" *B. Fresenius' J. Anal. Chem.* **1993** 3466-9, 863-867
- [50] Adler, B.; Dobers, S.; Will, J., "A 2 and 3 dimensional structure search to solve spectroscopic problems in industry" *J. Mol. Struct.* **1990** 217, 297-306
- [51] Lombardi, D.R.; Wang, C.; Sun, B.; Fountain, A.W.; Vickers, T.J.; Mann, C.K.; Reich, F.R.; Douglas, J.G.; Crawford, B.A.; Kohlasch, F.L., "Quantitative and qualitative analysis of some inorganic compounds by Raman spectroscopy" *Appl. Spectrosc.* **1994** 48, 875-883
- [52] Adar, F.; Geiger, R.; Noonan, J. "Raman process analyzers allow rapid online control" *J., InTech* **1997** 447, 57-59
- [53] Andrews, J., "Raman spectroscopy moves on-line" *Spectrosc. Eur.* **1995** 71, 8,10-13
- [54] Allred, C.D.; McCreery, R.L., "Near-infra-red Raman spectroscopy of liquids and solids with a fibre-optic sample, diode laser and charge-coupled device detector" *Appl. Spectrosc.* **1990** 44, 1229-1231
- [55] Hietala, M.; Kalnicky, D.J., "Applications of on-line XRF and XRD analysis techniques to industrial process control" *Adv. X-Ray Anal.* **1989** 32, 49-57
- [56] Varmola, K., "Development towards an integrated on-stream analyzer system for the mineral industry" *Nucl. Tech. Explor. Exploit. Energy Miner. Resour., Proc. Int. Symp.* **1991** Meeting Date, 135-49 Publisher: IAEA, Vienna, Austria

- [57] Cooper, H.R., "Advances in on-line particulate composition analysis" *Powder Technol.* **1992** 691, 93-99
- [58] Wolny, M., "Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te/Cd<sub>1-y</sub>Zn<sub>y</sub>Te characterization: from basic studies to online methods" *Mater. Sci. Eng., B* **1997** B441-3, 252-259
- [59] Allmann, R., *Röntgenpulverdiffraktometrie* **1994**, Sven von Loga-Verlag, Köln
- [60] Baumgärtel, L.; Finsterwalder, L., "In-Line Instrumentierung bei der Wiederaufarbeitung von bestrahlten Kernbrennstoffen" *Kerntechnik* **1970** 12, 347 ff.
- [61] Ertel, D.; Horn, G., "Analytik im Purex-Prozeß" *Atomkernenergie-Kerntechnik* **1985** 46, 89 ff.
- [62] Groll, P., "Inline-Instrumente und Laborautomaten für die Prozeßkontrolle des Purex-Prozesses" *Atomkernenergie-Kerntechnik* **1985** 46, 94 ff.
- [63] Wenli, L.; Ascenzo, G.D; Curini, R.; Gasparini, G.M.; Casarci, M.; Mattia, B.; Traverso, D.M.; Bellisario, F., "Study of online analysis using energy dispersive x - ray fluorescence spectrometry for controlling lanthanum and neodymium extraction" *Anal. Chim. Acta* **1998** 3622-3, 253-260
- [64] Anderson, D., "Procedures to minimize iron losses to steel plant waste gas cleaning systems" *Comm. Eur. Communities, [Rep.] EUR* **1998**, 1-29, 31-65, 69
- [65] Connolly, D.; Walker, C., "Online measurement of sub-ppb levels of metals using X-ray fluorescence" *Ultrapure Water* **1998** 153, 53-58
- [66] Graham, S.; Papp, B., "Petrochemical applications of Courier online analyzers" *Addit. Pet. Refin. Pet. Prod. Formulation Pract., Proc.* **1997**, 42-45
- [67] Yamashita, S.; Shimizu, T., "High sensitivity online sulfur analyzer for oil refineries" *Adv. Instrum. Control* **1996** 51Pt. 1, 23-32
- [68] Overman, A.R.; Fleming, R.R., "Energy dispersive X - ray fluorescence as a quality control tool for the analysis of fire retardants" *Tomorrow's Trends Fire Retard. Regul., Test., Appl. Curr. Technol., Fire Retard. Chem. Assoc., [Fall Conf.]* **1996**, 111-115
- [69] Berner, K., "Quality assurance and measurement techniques in the manufacture of steel sheets" *Semin. Zerstoerungsfreie Materialcharakt.* **1996**, 11-31 Publisher: Deutsche Gesellschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung, Berlin, Germany
- [70] Casarci, M.; Bellisario, F.; Gasparini, G.M.; Li, L.W.; Mattia, B.; Traverso, D.M., "The control of a solvent extraction process by means of an online stream EDXRF analytical system" *Value Adding Solvent Extr., [Pap. ISEC'96]* **1996** 2, 1121-1126
- [71] Collatuzo, P.; Rouse, H.; Delabac, G., "Utilisation d'un analyseur en ligne par fluorescence X pour le contrôle de qualité dans une exploitation de dolomie" *Mines Carriers: Tech.* **1995** 1-2, 42-46
- [72] Davidson, R.A.; Walker, E.B.; Barrow, C.R.; Davidson, C.F., "On-line radioisotope XRF analysis of Copper, Arsenic and Sulfur in Copper electrolyte purification solutions" *Appl. Spectrosc.* **1994** 48, 796-800

- [73] Matsumoto, Y.; Fujino, N.; Shibuya, A.; Nakase, I.; Koizumi, A., "On-line analyzers for nickel-zinc alloy electroplated steel sheet" *Sumitomo Search* **1990** 42, 9-16
- [74] Langheinrich, A.P.; Forster, J.W., "Application of radioisotope nondispersive X-ray spectrometry to the analysis of Molybdenum" *Adv. X-Ray Anal.* **1968** 11, 284 ff.
- [75] Ellis, A.T.; Potts, P.J.; Holmes, M.; Oliver, G.J.; Strelci, C.; Wobrauschek, P., "Atomic spectrometry update- x - ray fluorescence spectrometry" *J. Anal. At. Spectrom.* **1997** 1211, 461R-490R
- [76] Ellis, A.T.; Potts, P.J.; Holmes, M.; Oliver, G.L.; Strelci, C.; Wobrauschek, P., "Atomic spectrometry update - X - ray fluorescence spectrometry" *J. Anal. At. Spectrom.* **1996** 1111, 409R-442R
- [77] Price, B.J.; Ellis, A.T., "Multidispersive XRF: an improved concept in spectrometer design for quality control analysis" *Am. Lab. (Shelton, Conn.)* **1996** 28, 20, 22-4
- [78] Price, B.J., "Quality control analysis using XRF spectrometers" *World Cem.* **1994** 25, 54, 56-7, 120, 129
- [79] Gunning, G.R., "Applications of ED-XRF technology to on-line analysis" *Adv. X-Ray Anal.* **1993** 36, 105-109
- [80] Jordanov, J.; Tsanov, T.; Stefanov, R.; Yordanov, N.; Ortner, H.M.; Wiharitz, P.; Jenul, R., "Problems of automated qualitative X-ray fluorescence analysis" *X-Ray Spectrom.* **1993** 22, 97-102
- [81] Watson, W., "Energy dispersive X-ray fluorescence process analyzer for on-line elemental analysis" *Am. Lab.* **1990** 40, 42-43
- [82] Lundan, A., "On-line-Röntgenanalysatoren" *Chem.-Anlagen Verfahren* **1989** 22, 18,21
- [83] Harding, A.R., "Process control applications of the Peltier cooled lithium-drifted silicon detector based EDXRF spectrometer" *Adv. X-Ray Anal.* **1989** 32, 31-37
- [84] Weakliem, J.H.; Kalnicky, D.J., "Application of EDXRF analysis to continuous industrial process monitoring" *Adv. X-Ray Anal.* **1987** 30, 303-307
- [85] Donhoffer, D.K., "On-Stream-Analyse mittels energie-dispersiver Röntgenfluoreszenz" *Atomkernenergie Kerntechnik* **1984** 44, 266-268
- [86] Carr-Brion, K.G., "On-stream energy dispersive X-ray analysers" *X-Ray Spectrom.* **1973** 2, 63-67
- [87] Erhardt, H. (Hrsg), *Röntgenfluoreszenzanalyse, Anwendung in Betriebslaboratorien* **1989** 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo
- [88] Hahn-Weinheimer, P.; Hirner, A; Weber-Diefenbach, K., *Röntgenfluoreszenzanalytische Methoden: Grundlagen und praktische Anwendungen der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)* **1995** Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden
- [89] Valkovic, V.; Markowicz, A.; Haselberger, N., "Review of recent applications of radioisotope excited X-ray fluorescence" *X-Ray-Spectrom.* **1993** 22, 199-207

- [90] Foucher, J.P., "Industrial measurement and analysis by low energy gamma-radiation" *Analisis* **1993** 21, 20-22
- [91] Hoffmann, P., "Application of radionuclide sources for excitation in energy-dispersive X-ray fluorescence analysis" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1986** 323, 801-806
- [92] Sadasivan, S.; Varma, R.K.; Mishra, U.C., "Tube-excited energy-dispersive X-ray fluorescence system for environmental applications" *Indian J. Technol.* **1983** 21, 225-258
- [93] LaBrecque, J.J., "Radioisotope induced X-ray fluorescence" *Progress in Analytical Atomic Spectroscopy (UK)* **1981** 4, 191-217
- [94] van Alfthan, C.; Rautala, P., "Applications of a new multielement portable X-ray spectrometer to material analysis" *Adv. X-Ray Anal.* **1980** 23, 27-36
- [95] Spatz, R.; Lieser, K.H., "Kritischer Vergleich des Meßbereichs und der Nachweisgrenzen für die energiedisperse Röntgenfluoreszenzanalyse mit Röhrenanregung (Sekundärtaarget) und mit Radionuklidanregung ( $^{109}\text{Cd}$  und  $^{241}\text{Am}$ ) am Beispiel von Pulverschüttproben auf Kieselgelbasis" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1977** 319, 732-734
- [96] Herbert, A.J.; Street, K.Jr., "Nondispersive Soft X-ray fluorescence spectrometer for quantitative analysis of the major elements in rocks and minerals" *Anal. Chem.* **1974** 46, 203-207
- [97] Porter, D.E., "High intensity excitation sources for X-ray energy spectroscopy" *X-Ray Spectrom.* **1973** 3, 85 ff.
- [98] Dyer, G.R.; Gedcke, D.A.; Harris, T.R., "Fluorescence Analysis using an Si(Li) X-ray energy analysis system with low-power X-ray tubes and radioisotopes" *Adv. X-Ray Anal.* **1972** 15, 228 ff.
- [99] Jenkins, R.; de Vries, J.L., "Isotope excitation in on-stream analysis" *Can. Spectry* **1971** 16, 54 ff.
- [100] Górski, L., "Röntgenfluoreszenzanalyse mit radioaktiven Röntgenquellen und  $\gamma$ -Szintillations-Spektrometern" *Kernenergie* **1963** 12, 710-713
- [101] Szabo, J.L.; Simon, A.C.; Junca, R., "Non-destructive analysis of Uranium and/or Plutonium using X-ray (K- or L-band) fluorescence excited by sealed sources or X-ray tubes" *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.* **1994** 353, 668-671
- [102] Hoffmann, P.; Pilz, N.; Lieser, K.H., "Online determination of actinids by energy-dispersive XRF induced by gamma-emitting radionuclides" *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry* **1989** 132, 121-129
- [103] Pilz, N.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H.; Dams, W.; Nelges, K.H., "Non-destructive determination of Plutonium in nuclear fuel rods and pellets" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1989** 335, 695-697
- [104] Pilz, N.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H., "In-line determination of heavy elements by gamma ray-induced energy-dispersive K-line XRF" *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry* **1989** 130, 141-153

- [105] Arikan, P.; Ozmen, A., "Application of Compton scattering normalization method to the analysis of uranium ore" *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **1987** 108, 327-336
- [106] Efe, N.; Akman, S; Arikan, P., "Determination of rare-earth elements and thorium in brotite ore by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry" *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **1987** 117, 1-9
- [107] Pilz, N.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H.; Gavrides, S.G., "Determination of Thorium and Uranium in air filters by XRF analysis using excitation of K-lines by radionuclides" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1987** 329, 581-583
- [108] Pilz, N.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H., "On-line determination of heavy elements by energy-dispersive XRF induced by  $\gamma$ -emitting radionuclides" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1987** 327, 13
- [109] LaBrecque, J.J.; Rosales, P.A.; Mejías, G., "Simultaneous determination of lanthanides by radioisotope X-ray fluorescence spectrometry based on characteristic K-radiation" *Anal. Chim. Acta* **1986** 188, 9-14
- [110] Andrew, G.; Taylor, B.L., "The measurement of Pu and U in reprocessing plant solutions by tube excited K X-ray fluorescence" *J. Radioanal. Chem.* **1981** 62, 135 ff.
- [111] Kumpulainen, H., "Uranium analysis by K X-rays from geological samples" *J. Radioanal. Chem.* **1980** 59, 635 ff.
- [112] Pella, P.A.; Baeckmann, A.V., "The X-ray spectrometric determination of uranium and plutonium in solutions of spent nuclear fuels" *Anal. Chim. Acta* **1969** 47, 431-438
- [113] Camp, D.C.; Ruhter, W.D., "Nondestructive, energy-dispersive X-ray fluorescence analysis of actinide stream concentrations from reprocessed nuclear fuel" *Adv. X-Ray Anal.* **1980** 23, 163-176
- [114] Arikan, P.; Alkan, I., "Radioactive ore analysis by optimized radioisotope X-ray fluorescence technique" *J. Radioanal. Chem.* **1981** 67, 403 ff.
- [115] Hofmann, T.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H., "Online determination of actinids by energy-dispersive XRF induced by gamma-emitting radionuclides" *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **1987** 109, 419-437
- [116] Hoffmann, P.; Hofmann, T.; Pilz, N.; Lieser, K.H., "Bestimmung von Actiniden durch Röntgenfluoreszenzanalyse, angeregt durch  $\gamma$ -Strahler" *Fresenius Z. Anal. Chem.* **1985** 320, 652
- [117] Hofmann, T.; Hoffmann, P.; Lieser, K.H., "In-line determination of Uranium, Plutonium and Neptunium in process streams by energy-dispersive X-ray fluorescence analysis (EDXRF)" *J. Radioanal. Nucl. Chem.* **1984** 82, 201-204
- [118] *Isotrak-Nuclea Data*, Amersham International plc. **1995** Section 4, 38-49
- [119] Atkins, P.W., *Physikalische Chemie* **1990** 2. korr. Auflage, VCH Verlagsgesellschaft Weinheim
- [120] Hoffmann, P., *Instrumental Chemical Analysis - Vorlesungsskript - 1995* 1. Auflage

- [121] R6V, **1987**
- [122] DIN 54 113 **November 1995 Teil 1 - 3**
- [123] Nachtigal, D., *Physikalische Grundlagen für Dosimetrie und Strahlenschutz* **1971** Karl Thiemig Verlag München
- [124] Elfman, M.; Homman, N.P.O.; Kristiansson, P., "Development of an anti-Compton shield for a lithium-drifted silicon detector employed in PIXE analysis" *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B* **1995** B95, 122-126
- [125] Vane, R.A.; Stewart, W.D., "The effective use of filters with direct excitation of EDXRF" *Adv. X-Ray Anal.* **1980** 23, 231-239
- [126] Spatz, R.; Lieser, K.H., "Optimization of a spectrometer for energy-dispersive X-ray fluorescence analysis bei X-ray tubes in combination with secondary targets for multielement determination" *X-Ray Spectrom.* **1979** 8, 110-113
- [127] Gedcke, D.A.; Elad, E., "An intercomparison of trace element excitation methods for energy-dispersive fluorescence analyzers" *X-Ray Spectrom.* **1977** 6, 21-29
- [128] MCDWIN<sup>®</sup> *Users manual* **20.03.1997 Version 1.5**, Fast Com Tec, D - 82041 Oberhaching
- [129] Kleiner, J., "Statistische Qualitätssicherung im analytischen Labor" *Laborpraxis* **1997** 12, 34-37
- [130] DIN 32 645 **1994**
- [131] Weinbruch, S., *Anwendung statistischer Methoden in der Materialwissenschaft* **1993** (Vorlesungsskript)
- [132] Gellert, W.; Küstner, H.; Hellwich, M.; Kästner, H., *Kleine Enzyklopädie der Mathematik* **1986** 13. Auflage, VEB Bibliographisches Institut Leipzig
- [133] Compton, A.H.; Allison, S.K., *X-rays in Theory and Experiment* **1935** 2nd ed., D. Van Nostrand, Princeton, N.J.
- [134] Jenkins, R.; Gould, R.W.; Gedcke, D., *Quantitative X-ray spectrometry* **1981** 10th ed., Marcel Dekker Inc. New York, Basel
- [135] Davisson, C.M. (ed. K. Siegbahn, North-Holland Publ. & Co., Amsterdam), "Interactions of  $\gamma$ -radiation with matter" *Alpha- beta- and gamma-ray spectroscopy* **1965** 1, 37 ff.
- [136] Zschornak, G., *Atomdaten für die Röntgenspektralanalyse* **1989** 432-465, Springer-Verlag, Berlin
- [137] Spatz, R., "Anwendung der energiedispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse als Multi-element-Methode für die Spurenelementbestimmung in silikatischen Proben" *Dissertation* **1978** Darmstadt
- [138] George, R.; Schiekel, M., "Application limits in using back-scattered radiation for matrix correction in X-ray fluorescence analysis" *J. Radioanal.-Nucl. Chem.* **1983** 79, 233-243
- [139] Szegedi, S.; Tun, K.M.; Ibrahim, S.M., "Determination of ash content in coals by gamma reflection method" *J. Radioanal.-Nucl. Chem.* **1996** 213, 403-409

- [140] Confalonieri, L.; Crippa, R.; Milazzo, M.; "Experimental approach to analysis of binary alloys by Rayleigh - Compton back-scatter ratio method" *Appl. Radiat. Isot.* **1987** 38, 139-142
- [141] Kunzendorf, H., "Quick Determination of the average atomic number Z by X-ray scattering" *Nuclear Instruments and methods* **1972** 99, 611-612
- [142] Lindgren, F.; Sjostrom, M.; Berglind, R.; Nyberg, B., "Modeling of the biological activity for a set of ceramic fiber materials: a QSAR study" *Environ. Res.* **1996** 54, 299-310
- [143] Swerts, J.; Aerts, A.; De Biscop, N.; Adams, F.; Van Espen, P., "Age determination of Chinese porcelain by X-ray fluorescence and multivariate analysis" *Chemom. Intell. Lab. Syst.* **1994** 22, 97-105
- [144] Urbanski, P., "Principal component and partial least squares regression in the calibration of nucleonic gages" *Appl. Radiat. Isot.* **1994** 456, 659-67
- [145] Eggert, F.; Scholz, W., "A rapid deconvolution method based on the Bayesian Theorem applied to Energy Dispersive X-Ray Emission Analysis" *Phys. stat. sol. (a)* **1985** 88, K 123-K 125
- [146] Blaffert, T., "Computer-assisted multicomponent spectral analysis with Fuzzy data sets" *Anal. Chim. Acta* **1984** 161, 135-148
- [147] Marageter, E.; Wegscheider, W.; Müller, K., "A novel method for nonlinear least-squares in analysis of energy-dispersive x-ray spectra" *Nucl. Instr. & Methods in Physics Research* **1984** B 1, 137-145
- [148] Goulding, F.S.; Jaklenc, J.M.; Jarrett, B.V.; Landis, D.A., "Detector background and sensitivity of semiconductor X-ray fluorescence spectrometers" *Adv. X-Ray Anal.* **1972** 15, 470 ff.
- [149] Koch, S.; Jugelt, P.; Schmiedl, H.-D., "Energiedispersive Röntgenspektrometrie und ihr Einsatz zur Elementanalyse von Mikrobereichen" *Wiss. Zeitschr. d. TU Dresden* **1976** 25, 159-167
- [150] Kunzendorf, H.; Wollenberg, H.A., "Determination of rare-earth elements in rocks by isotopeexcited x-ray fluorescence spectrometry" *Nucl. Instr. and Methods* **1970** 87, 197-203
- [151] Mariscotti, M.A., "A method for automatic identification of peaks in the presence of background and its application to spectrum analysis" *Nucl. Instr. and Methods* **1967** 50, 309-320
- [152] Blanco, M.; Coello, J.; Iturragia, H.; MasPOCH, S.; Betran, E., "Analysis of cotton-polyester yarns by near-infrared reflectance spectroscopy" *Analyst (Cambridge, UK)* **1994** 119, 1779-85
- [153] Peters, D.C.; Shearer, J., "Applications of FT-NIR spectroscopy to process monitoring" *Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng.* **1993** 2069, 42-9



- [154] Brown, S.D.; "On-line polymeric measurements in real-time with NIR spectroscopy" *Appl. Spectrosc.* **1995** 49, 14A-32A)
- [155] Beebe, K.R.; Kowalski, B.R., "An introduction to multivariate calibration and analysis" *Anal. Chem.* **1987** 59, 1007A-1017A
- [156] Frank, I.E.; Todeschini, R., *The data analysis handbook* **1994**, Elsevier, Amsterdam
- [157] Massart, D.L.; Vandeginste, B.G.M.; Deming S.N.; Michotte, Y.; Kaufman, L., *Chemometrics; a textbook* **1988** Elsevier, Amsterdam
- [158] Cancilla, D.A.; Fang, X., "Evaluation and quality control of environmental analytical data from Niagara River using multiple chemometric methods" *J. Great Lakes Res.* **1996** 22, 241-253
- [159] Henrion, R.; Rassmann, U.; Henrion, G., "Chemometric analysis of the behavior of trace element concentrations in tungsten wire production" *Anal. Chim. Acta* **1990** 241, 147-151
- [160] Pyle, S.M.; Necerino, J.M.; Deming, S.N.; Palasota, J.A.; Palasota, J.M.; Miller, E.L.; Hillman, D.C.; Kuharic, C.A.; Cole, W.H.; Fitzpatrick, P.M.; Watson, M.A.; Nichols, K.D., "Comparison of AAS ICP, AES, PSA and XRF in determining lead and cadmium in soil" *Environ. Sci. Technol.*, **1996** 30 204-213
- [161] Miranda, J.; Andrade, E.; Lopez-Suarez, A.; Ledesma, R.; Cahill, T.A.; Wakabayashi, P.H., "A receptor model for atmospheric aerosols from a southwestern site in Mexico City" *Atmos. Environ.* **1996** 3020, 3471-3479
- [162] Hiraoka, Y., "A possible approach to soil discrimination using X-ray fluorescence analysis" *J. Forensic Sci.* **1994** 39, 1381-1392
- [163] Sawhney, K.J.S.; Lodha, G.S.; Singh, B.R., "Minor and trace element estimation in bauxites using energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry" *Nucl. Geophys.* **1989** 32, 125-30
- [164] Kolata, D.R.; Frost, J.K.; Huff, W.D., "K-bentonites of the Ordovician Decorah Subgroup, Upper Mississippi Valley: correlation by chemical fingerprinting" *Gov. Rep. Announce. Index U. S.* **1986** 86(18), Abstr. No. 640,504
- [165] Swanson, M.T.; Sclar, C.B., "Multivariate discrimination of geochemical signatures in sphalerite concentrates from discrete ore bodies of the Balmat-Edwards district, St. Lawrence Co., New York" *Proc. Quadrenn. IAGOD Symp.*, 6th **1984**, Volume 1, 525-532
- [166] Selinus, O., "Factor and discriminant analysis to litho-geochemical prospecting in an area of central Sweden" *J. Geochem. Explor.* **1983** 191-3, 619-642
- [167] Hutchison, R.I.; Skinner, D.L.; Bowes, D.R., "Discriminant trace-element analysis of strata in the Witwatersrand System" *J. Int. Assoc. Math. Geol.* **1976** 84, 413-427
- [168] Yen, F.-S.; Goodwin, J.H., "Correlation of tuff layers in the Green River Formation, Utah using biotite compositions" *J. Sediment. Petrol.* **1976** 462, 345-354
- [169] Remola, J.A.; Larrechi, M.S.; Rius, F.X., "Chemometric characterization of 5th century A.D. amphora-producing centres in the Mediterranean" *Talanta* **1993** 40, 1749-1757

- [170] Yap, C.T., "Multivariate analysis of trace elements for XRF studies for classification according to origin" *Appl. Spectrosc.* **1992** 46, 843-847
- [171] Yap, C.T., "EDXRF studies of the Nanking Cargo with principal-component analysis of trace elements" *Appl. Spectrosc.* **1991** 45, 584-587
- [172] Yap, C.T.; Vijayakumar, V., "Principal component analysis of trace elements from EDXRF (energy-dispersive XRF) studies" *Appl. Spectrosc.* **1990** 44, 1080-1083
- [173] Rius, F.X.; Larrechi, M.S.; Benet, C.; Subias, E.; Massart, D.L.; Thielemans, A., "Application of multivariate techniques to data from Spanish glass objects from the Roman area" *Anal. Chim. Acta* **1989** 225, 69-81
- [174] Hughes, M.J.; Hall, J.A., "X - ray fluorescence analysis of late Roman and Sassanian silver plate" *J. Archaeol. Sci.* **1979** 64, 321-344
- [175] Benninghoff, L.; von Czarnowski, D.; Denkhaus, E.; Lemke, K., "Analysis of human tissues by total reflection x - ray fluorescence . Application of chemometrics for diagnostic cancer recognition" *Spectrochim. Acta, Part B* **1997** 52B7, 1039-1046
- [176] Drake, E.N., II; Sky-Peck, H.H., "Discriminant analysis of trace element distribution in normal and malignant human tissues" *Cancer Res.* **1989** 4915, 4210-4215
- [177] Majcen, N.; Xavier, R.F.; Zpan, J., "Linear and non-linear multivariate analysis in the quality control of industrial titanium dioxide white pigment" *Anal. Chim. Acta* **1997** 348, 87-100
- [178] Haswell, S.J.; Walmsley, A.D., "Multivariate data visualization methods based on multi-elemental analysis of wines and coffees using total reflection X - ray fluorescence analysis" *J. Anal. At. Spectrom.* **1998** 132, 131-134
- [179] Vekemans, B.; Janssens, K.; Vincze, L.; Aerts, A.; Adams, F.; Hertogen, J., "Automated segmentation of  $\mu$ -XRF image sets" *X-Ray Spectrom.* **1997** 266, 333-346
- [180] Issahary, D.; Pelly, I., "Phosphate beneficiation by calcination. Prediction of phosphorus pentoxide in the product, mining and plant control" *Int. J. Miner. Process.* **1985** 153, 219-30
- [181] Magallanes, J.F.; Vazquez, C. "Automatic Classification of Steels by Processing Energy-Dispersive X-ray Spectra with Artificial Neural Networks" *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* **1998** 384, 605-609
- [182] Nineta, M.; Rius, X.F.; Zupan, Jure, Z., "Linear and non-linear multivariate analysis in the quality control of industrial titanium dioxide white pigment" *Anal. Chim. Acta* **1997** 3481-3, 87-100
- [183] Molt, K.; Schramm, R., "Application of factor analysis in EDXRF" *Fresenius J. Anal. Chem.* **1997** 359, 61-66
- [184] Esbensen, K.; Schönkopf, S.; Midtgaard, T., *Multivariate Analysis in Practice* **1994** Wennbergs Trykkeri AS, Trondheim

- [185] Einax, J., *Chemometrics in environmental analysis* **1997** VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim
- [186] Henrion, R.; Henrion, G., *Multivariate Datenanalyse* **1994** Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York
- [187] Baldovin, A.; Wen, W.; Massart, D.L.; Turello, A., "Regularized discriminant analysis RDA - Modeling for the binary discrimination between pollution types" *Chemom. Intell. Lab. Syst.* **1997** 381, 25-37
- [188] Mallet, Y.; Coomans, D.; de Vel, O., "Recent developments in discriminant analysis on high dimensional spectral data" *Chemom. Intell. Lab. Syst.* **1996** 352, 157-173
- [189] Wu, W.; Mallet, Y.; Walczak, B.; Penninckx, W.; Massart, D.L.; Heuerding, S.; Erni, F., "Comparison of regularized discriminant analysis, linear discriminant analysis and quadratic discriminant analysis, applied to NIR data" *Anal. Chim. Acta* **1996** 3293, 257-265
- [190] Wu, W.; Massart, D.L. "Regularized nearest neighbor classification method for pattern recognition of near infrared spectra" *Anal. Chim. Acta* **1997** 3491-3, 253-261
- [191] Frank, I.E.; Friedman, J.H., "Classification: oldtimers and newcomers" *J. Chemom.* **1989** 33, 463-75
- [192] Friedman, J.H., "Regularized Discriminant Analysis" *J. Am. Stat. Assoc.* **1989** 84, 165-175
- [193] Johnson, R.A.; Wichern, D.W., *Applied Multivariate Statistical Analysis* **1982** Prentice Hall, New Jersey
- [194] *SCAN<sup>®</sup> Reference Manual (Release 1 for Windows<sup>®</sup>)* **1995**